

GaN-SBD를 이용한 RF-DC 변환기 회로 분석

손명식^{*†}

^{*†}순천대학교 전자공학과

An Analysis of RF-DC Converter Circuits with GaN Schottky Barrier Diodes

Myung Sik Son^{*†}

^{*†}Department of Electronic Engineering, Sunchon National University, Korea

ABSTRACT

In this paper, GaN-SBD devices with excellent breakdown voltage and frequency characteristics for use in high-power microwave wireless power transmission has been modeled for PSpice circuit simulation. The RF-DC conversion circuits were simulated and compared with a commercial Si-SBD device. Although the modeled GaN-SBD devices had lower RF-DC conversion efficiency compared to Si-SBD at 2.4 and 5.8 GHz, it was confirmed through PSpice circuit simulations that they can be used sufficiently according to the required application circuit in a high power situation.

Key Words : Microwave, Wireless Power Transmission System, RF-DC Converter, Schottky Barrier Diode, GaN

1. 서 론

マイクロ파 무선전력전송 기술[1]을 이용하여 모바일 기기를 충전하기 위한 RF 무선충전 방식에 대한 연구들이 진행되어 왔다[2,3]. 5.8-GHz RF신호를 수신하여 RF-DC 변환기를 거쳐 수신된 DC전력을 이용하여 스마트폰을 충전하는 방식이다[3]. 이 방식인 경우 RF 전력 송수신기 간 거리, 주변 장애물, 수신기 효율 등에 따라 수신 세기가 불안정하게 변하므로 스마트폰 충전에 필요한 5V를 안정적으로 공급하고 동시에 충분한 충전 전류를 제공하기 위해서는 최적화된 RF-DC 변환기 회로가 필수적이다 [4].

그러나, RF-DC 변환기 회로가 최적화되어 좋은 변환 효율을 보이더라도 송신단의 송전 전력이 충분하지 않으면 수신단에서 수신된 DC 전류가 충분하지 않아 충전 시간

이 너무 많이 걸려 충전 자체가 불가능해진다. 또한, 송전 전력이 매우 큰 대전력 마이크로파 무선전력전송[1]인 경우에 실리콘(Si)-SBD(Schottky Barrier Diode) 소자를 사용하면 낮은 항복전압 특성으로 인해 쉽게 소자가 타버리는 단점이 있다. 우수한 항복전압 특성을 보이는 GaN(Gallium Nitride)-SBD를 사용하였을 때는 주파수 특성이 Si-SBD에 비해 떨어진다. 따라서, 이러한 두 소자들의 주파수 특성을 비교 분석할 필요가 있다.

본 논문에서는 실리콘에 비하여 GaN는 녹는 점이 높고 높은 온도에 강하며, 전달 속도가 빠르면서 전달 전류의 양도 실리콘에 비해 많은 GaN-SBD 소자[5]를 사용해 기존의 RF-DC 변환기 회로들[4]의 주파수 특성 및 고전력 무선전송으로 인한 수신된 고전압에 따른 전류 특성을 PSpice 회로 시뮬레이션[6]을 통해 실리콘-SBD 소자와 비교 분석하였다.

[†]E-mail: sonms@sunchon.ac.kr

2. GaN-SBD PSpice 소자 모델링

2.1 GaN-SBD 소자 구조 및 I-V 특성

시뮬레이션을 위해 사용한 GaN-SBD 소자[5]는 그림 1에 보인 바와 같은 에피 구조와 측면 구조를 가지고 있으며 셀트키 접촉을 위해 TiN/Ni/Au 구조의 3층으로 이루어진 금속 접촉으로 구성되었다. 논문에서 분석된 TiN의 셀트키 장벽 높이는 0.6 eV로 설정되었다.

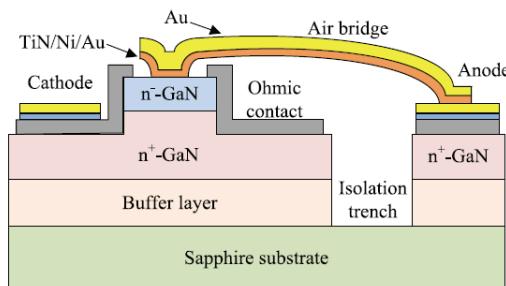


Fig. 1. Cross sectional view of the GaN-SBD [5].

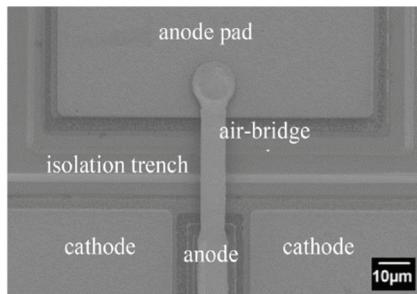


Fig. 2 Top view of one-finger GaN-SBD from scanning electron microscope [5].

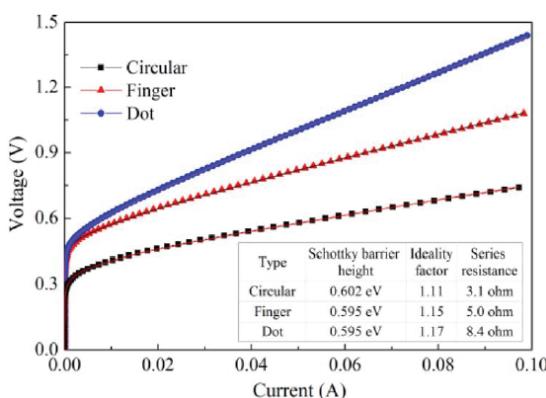


Fig. 3. I-V characteristics of TiN GaN-SBD[5].

그림 2와 같은 위에서 본 연결 구조에서 셀트키 접촉을 이루는 형상에 따라서 Circular 형, Finger 형, 그리고 Dot 형으로 구분된 소자로 나누게 된다. 그림 3에서는 이러한 셀트키 접촉 형상에 따른 전류-전압 순방향 특성을 보였다.

이 그림에서 그들 논문 [5]의 분석에 의하면 Ideality factor N과 Series resistance Rs의 영향을 가장 많이 받는 것으로 분석되었고 그림 위에 정리한 셀트키 장벽 높이와 N 및 Rs 파라미터를 사용하여 실험 데이터와 일치시킨 그림이다.

2.2 GaN-SBD 소자 모델링 및 파라미터 결정

PSpice 회로 시뮬레이션을 위해서 논문 [5]에서 분석된 파라미터를 사용하여 PSpice의 SBD 파라미터를 설정한 경우 그림 3의 각 소자의 I-V 특성을 정확하게 시뮬레이션 할 수 없었다. 이는 Pspice의 SBD 다이오드 모델에 사용하는 다이오드 방정식과 논문 [5]에서 분석한 다이오드 방정식의 차이로 예상하여 N 및 Rs 파라미터를 논문 [5]에서의 파라미터 값을 기준으로 변화시키면서 그림 3의 실험 데이터에 일치시키는 파라미터를 표 1에 보인 바와 같이 결정하였다.

Table 1. Parameters used for Si-SBD and GaN-SBDs.

	Parameters
HS-286	+IS=5E-8 RS=6 N=1.08 EG=0.69 +XTI=2 BV=7 IBV=1E-5 CJO=0.18p +VJ=0.65 M=0.5 FC=0.5 TT=0 +KF=0 AF=1
Circular	+IS=5E-8 RS=2.94 N=1.2 EG=0.69 +XTI=2 BV=40 IBV=1E-5 CJO=23p +VJ=0.60 M=0.5 FC=0.5 TT=0 +KF=0 AF=1
Finger	+IS=5E-8 RS=4.5 N=1.7 EG=0.69 +XTI=2 BV=40 IBV=1E-5 CJO=23p +VJ=0.60 M=0.5 FC=0.5 TT=0 +KF=0 AF=1
Dot	+IS=5E-8 RS=8 N=1.75 EG=0.69 +XTI=2 BV=40 IBV=1E-5 CJO=23p +VJ=0.60 M=0.5 FC=0.5 TT=0 +KF=0 AF=1

표 1에서 Si-SBD로서 HS-286 소자[7]를 사용하였고, GaN-SBD는 Circular, Finger, Dot 형 소자를 사용하였다. Si-SBD와 GaN-SBD의 BV(Breakdown voltage)은 7V와 40V로 설정되었다[4,5]. 따라서, GaN-SBD 소자들은 Si-SBD 소자 보다 더 큰 전압에서 동작시킬 수 있다.

그림 4에서는 Si-SBD(HS-286)과 GaN-SBD 소자들(Circular, finger, Dot)의 순방향 Turn-On 특성을 비교하기 위해 표 1의 파라미터를 사용하여 순방향 Turn-On 특성을 나타내었다. Circular 형은 0.38V, Finger 형은 0.5V, Dot 형은 0.56으로 그림

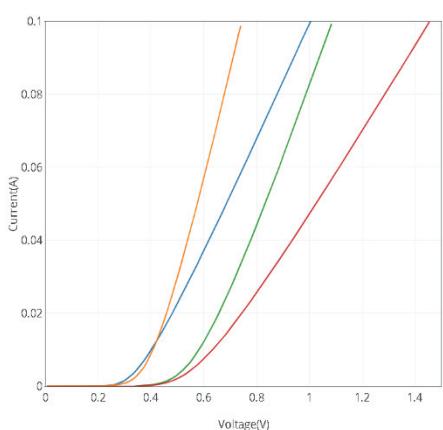


Fig. 4. I-V characteristics of Si-SBD and GaN-SBDs [5].

3에서의 Turn-On 특성과 아주 잘 일치하는 결과를 얻었다. HS-286 Si-SBD소자와 Circular형 GaN-SBD소자의 Turn-On 전압은 비슷하나 R_s 저항이 HS-286소자가 큼으로 전압에 따른 전류 상승 기울기가 작음을 알 수 있다.

3. RF-DC 회로 시뮬레이션 결과 및 분석

시뮬레이션할 RF-DC 변환기 회로들[3,4]을 그림 5와 6 및 7에 각각 나타내었다. 그림 5는 브리지 정류 회로(Bridge rectifier)이고, 그림 6은 반파 더블러 회로(Half-wave doubler), 그리고 그림 7은 전파 더블러 회로(Full-wave doubler)이다. 그림 5, 6, 및 7의 RF-DC 변환 회로들을 실리콘-SBD 소자인 HS-286 및 GaN-SBD 소자인 Circular 형, Finger형 및 Dot 형 소자에 대해 시뮬레이션을 수행하였다.

시뮬레이션을 위해 주파수는 60Hz, 900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz를 사용하였으며 회로내의 각 커패시터는 낮은 주파수인 60Hz와 900MHz에서는 4800nF를 사용하였고, 2.4GHz 및 5.8GHz에서는 4800pF으로 설정하여 사용하였다.

RF-DC 브리지 회로 시뮬레이션 결과를 각 주파수 별로 변환된 DC 전압과 전류로 정리하여 표 2에 정리하였다. 또한, 2.4GHz에서의 실리콘-SBD 소자인 HS-286 및 GaN-SBD 소자인 Circular 형 소자의 결과를 표 3에 정리하였다.

표 2의 RF-DC 회로 시뮬레이션 결과를 보면 수전 전압이 3V인 경우 Si-SBD 소자와 GaN-SBD 소자들이 주파수가 2.4GHz까지 증가함에 따라서 출력 전압이 조금씩 감소하는 것을 알 수 있다. 이는 주파수가 증가함에 따라서 RF-DC 변환 회로의 효율이 떨어진다는 것을 의미한다.

또한, GaN-SBD 소자들인 Circular, Finger, Dot를 비교해 보면 Circular형이 출력 전압 및 전류가 제일 좋고 그 다음이

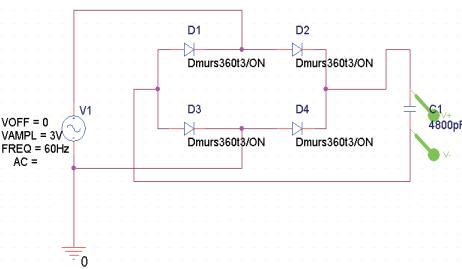


Fig. 5. The circuit of Bridge rectifier (Bridge).

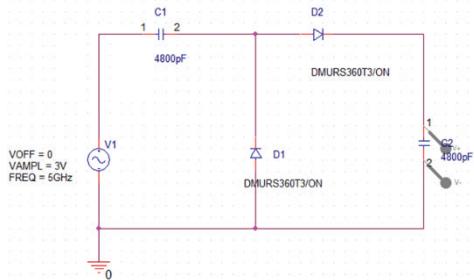


Fig. 6. The circuit of Half-wave doubler (Half-D).

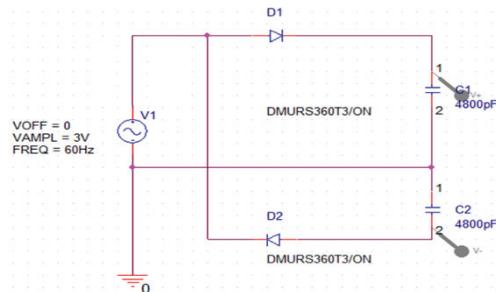


Fig. 7. The circuit of Full-wave doubler (Full-D).

Finger형 마지막인 Dot형인 것을 알 수 있었다. 또한, 5.8GHz에서는 수전된 전압이 30V로 가정한 경우, 실리콘 소자인 HS-286 소자에 비해 Circular형 GaN 소자가 월등히 좋은 변환 효율을 나타낸다.

따라서, GaN 소자는 2.4GHz에서 HS-286 실리콘 소자에 비해 RF-DC 변환 효율이 떨어지나 대전력 마이크로파 무선전력전송(30V 수전 입력) 같은 경우에는 5.8GHz에서의 변환 효율이 실리콘 소자에 비해 뛰어난 특성을 나타낸다.

표 3에서는 Si-SBD 소자 및 GaN-SBD 소자를 직접적으로 비교하기 위하여 2.4GHz에서 3V 입력시의 결과를 각 RF-DC 회로에 대해서 시뮬레이션한 결과를 정리하였다.

Bridge 회로는 Circular형이 HS-286보다 변환 효율이 좋았

Table 2. Simulation results of Bridge rectifier

Bridge Rectifier			HS-286	CIRCULAR	FINGER	DOT
C=4800nF	60Hz	전압	2.81V	2.78V	2.67V	2.66V
		전류	166.22mA	295.35mA	167.85mA	99.25mA
	900MHz	전압	2.78V	2.75V	2.64V	2.63V
		전류	166.23mA	295.36mA	167.79mA	99.25mA
C=4800pF	2.4GHz	전압	2.59V	1.61V	757.88mV	243.27mV
		전류	90.58mA	116.02mA	12.7mA	185uA
	30V 5.8GHz	전압	6.81V	18.35V	12.64V	5.88V
		전류	837.43mA	2.06A	1.04A	341.12mA

Table 3. Simulation results at 2.4GHz

2.4GHz				
		Bridge	Half-D	Full-D
전압	Circular	1.61V	4.97V	4.96V
	HS-286	2.59V	5.5V	5.55V
전류	Circular	116.02mA	199.57mA	192.58mA
	HS-286	90.58mA	126.83mA	124.98mA

으며 반파 더블러(Half-D)와 전파 더블러(Full-D)는 전압 변환 효율이 HS-286 실리콘 소자가 Circular형 GaN 소자에 비해 우수했으나 출력 전류 특성이 GaN 소자가 더 우수함을 보여주었다. 이는 전류 전달 특성이 GaN가 더 우수하다는 걸 의미한다.

4. 결 론

본 논문에서는 대전력 마이크로파 무선전력전송에 사용하기 위한 항복전압과 주파수 특성이 우수한 GaN-SBD 소자를 모델링하여 RF-DC변환 회로에 대해 시뮬레이션하고 상용Si-SBD 소자와 비교 분석하였다. 모델링된 GaN-SBD 소자들은 2.4 및 5.8GHz에서 Si-SBD에 비해 RF-DC 변환 효율이 떨어졌으나 대전력 상황에서는 요구되는 응용 회로에 따라 충분히 사용될 수 있음을 PSpice 회로 시뮬레이션을 통해 확인하였다. GaN-SBD 소자의 경우 Turn-On 전압이 0.38V 정도의 Circular형 소자가 2.4GHz 및 5.8 GHz에서도 RF-DC 변환 효율이 가장 우수함을 보여주었다.

Finger형 및 Dot 형은 비교적 낮은 전류로 대전력 상황에서는 Rs 성분이 커서 2.4나 5.8GHz에서는 Circular형에 비해 변환 효율이 떨어짐을 확인할 수 있었다.

감사의 글

순천대학교 교연비 사업에 의하여 연구되었음.

참고문헌

- Biao Hu, Hao Li, Tianming Li, Haiyang Wang, Yihong Zhou, Xiaoyun Zhao, Xin Hu, Xuekun Du, Yulong Zhao, Xiang Li, Tian Qi, Mohamed Helaoui, Wenhua chen, Fadhel Ghannouchi, “A long-distance high-power microwave wireless power transmission system based on asymmetrical resonant magnetron and cyclotron-wave rectifier”, Energy Reports 7, pp.1154-1161, 2021.
- Seong Hun Lee and Myung Sik Son, “5.8GHz 25W Microwave Wireless Power Transmission System Development and Measurement” Journal of the Semiconductor & Display Technology, Vol. 16, No.1, pp. 21-24, 2019.
- Seong Hun Lee and Myung Sik Son, “RF-DC Voltage Multiplier Design and Fabrication for 5.8GHz Microwave Wireless Power Transmission,” Journal of the Semiconductor & Display Technology, Vol. 16, No. 2, pp. 1-4, 2017.
- Myung Sik Son, “An Analysis of Voltage Multiplier Circuits for Smart Phone RF Wireless Charging,” Journal of the Semiconductor & Display Technology, Vol. 20, No. 2, pp.29-33, 2021.
- Liuan Li, Akinori Kishi, Qiang Liu, Yuki Itai, Ryota Fujihara, Yasuo Ohno and Jin-Ping Ao, “GaN Schottky Barrier Diode with TiN Electrode for Microwave Rectification”, Journal of the electron Devices Society, Vol. 2, No. 6, pp.168-173, 2014
- PSpice simulation tool, OrCAD ver.10.5, Cadence Design Systems, Inc.
- Spice Parameters, Datasheet of HSMS-286x, AVAGO Technology.

접수일: 2021년 11월 6일, 심사일: 2021년 12월 8일,
제재확정일: 2021년 12월 14일